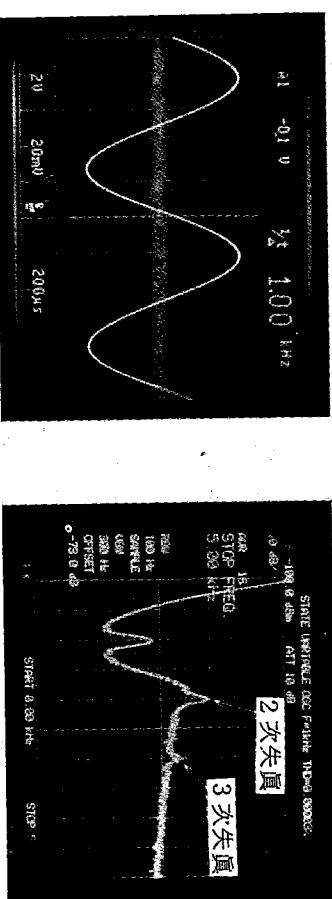


5-3 移相型CR振盪電路

圖5-5是使用有 $+90^\circ$, -90° 移相電路之振盪，在振盪迴路內未加入有AGC放大器，與其他方式比較時，此種電路是可以使失真率降低的一種振盪方式，其中之移相電路之電阻R和電容器C之加入方式不同為其特點。



照片5-3 輸出波形和殘留失真

照片5-4 高諧波頻譜

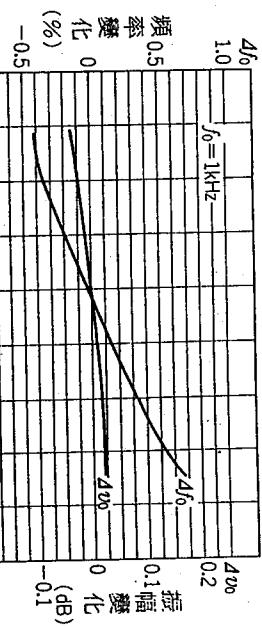


圖5-4 機率、振幅之溫度特性

運算放大器本身之高諧波失真以其原來之狀態出現，經由使用低失真運算放大器NE 5532 A（假如使用LM 833 A其性能會比較差）可以獲得 THD = 0.00005%（雜訊加以忽略，只測試高諧波）。在 A_1 , A_2 之回授電阻並聯有 47 pF 之電容器用來防止高頻振盪。

振幅控制電路

在低失真振盪電路中，失真率受振幅穩定電路之左右，所以需要特別注意設計。經由振幅檢測用之整流電路產生在 VCA 控制電壓中

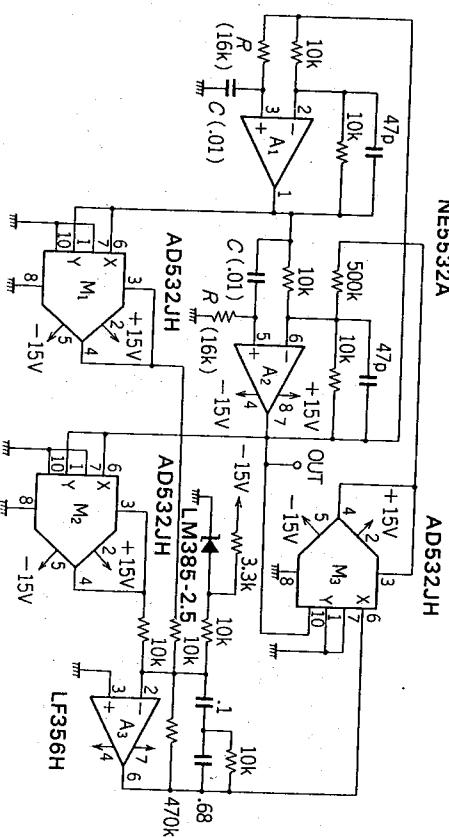


圖5-5 移相型CR振盪電路